

重点产品推荐

TH510系列半导体器件C-V特性分析仪

性能特点

- 一体化设计：LCR+栅极电压V_{GS}+漏极电压V_{DS}+通道切换+上位机软件
- 栅极电压V_{GS}: 0 - ±40V
- 漏极电压V_{DS}: 0 - ±200V/±1500V/±3000V
- 单管器件（点测）、模组器件（列表扫描）、曲线扫描(选件)
三种测试方式
- 四寄生参数(Ciss、Coss、Crss、Rg或Cies、Coes、Cres、Rg)
同屏一键测量及显示
- 标配2通道，可扩展至6通道，可测单管、多芯或模组器件
(TH513仅1通道)
- CV曲线扫描、Ciss-Rg曲线扫描
- 电容快速充电技术，实现快速测试
- 接触检查Cont
- 通断测试OP_SH
- 自动延时设置
- Crss Plus功能：解决高频下Crss负值问题
- 高压击穿保护：DS瞬间短路，保护仪器
- Interlock安全锁功能：增加高压防护墙(仅TH513)
- Cs-V功能：二极管结电容CV特性测试分析
- 等效模式转换功能，可选Cs或Cp模式
- 10档分选

应用

- 半导体元件/功率元件
二极管、三极管、MOSFET、IGBT、晶闸管、集成电路、
光电子芯片等寄生电容测试、C-V特性分析
- 半导体材料
晶圆、C-V特性分析
- 液晶材料
弹性常数分析

技术参数

产品型号		TH511	TH512	TH513		
通道数		2 (可选配4/6通道)		1		
显示	显示器	10.1英寸(对角线)电容触摸屏				
	比例	16:9				
	分辨率	1280×RGB×800				
测量参数		Ciss、Coss、Crss、Rg，四参数任意选择				
测试频率	范围	1kHz-2MHz				
	精度	0.01%				
	分辨率	10mHz	1.00000kHz-9.99999kHz			
		100mHz	10.0000kHz-99.9999kHz			
		1Hz	100.0000kHz-999.999kHz			
		10Hz	1.00000MHz-2.00000MHz			
测试电平	电压范围	5mVrms-1Vrms				
	准确度	± (10%×设定值+2mV)				
	分辨率	1mVrms	5mVrms-1Vrms			
V _{GS} 电压	范围	0 - ±40V				
	准确度	1%×设定电压+8mV				
	分辨率	1mV	0V - ±10V			
V _{DS} 电压	范围	0 - ±200V		0 - ±1500V		
	准确度	1%×设定电压+100mV		0 - ±3000V		



标配 RS232 ✓ | USB HOST ✓ | USB DEVICE ✓ | LAN ✓ | HANDLER ✓

TH510系列

体积 (mm) : 430(W)×177(H)×405(D)

净重: 约16 kg

重点产品推荐

TH510系列半导体C-V特性分析仪

产品型号	TH511	TH512	TH513
输出阻抗	100Ω, ±2%@1kHz		
数学运算	与标称值的绝对偏差Δ, 与标称值的百分比偏差Δ%		
校准功能	开路OPEN、短路SHORT、负载LOAD、夹具校准		
测量平均	1-32次		
AD转换时间 (ms/次)	快速+: 2.5ms(> 5kHz) 快速: 11ms 中速: 90ms 慢速: 220ms		
最高准确度	0.5% (具体参考说明书)		
Ciss, Coss, Crss	0.00001pF - 9.99999F		
Rg	0.001mΩ - 99.9999MΩ		
Δ%	± (0.000% - 999.9%)		
多功能参数 列表扫描	点数	50点, 每个点可设置平均数, 每个点可单独分选	
	参数	测试频率、Vg、Vd、通道	
	触发模式	顺序SEQ: 当一次触发后, 在所有扫描点测量, /EOM/INDEX只输出一次 步进STEP: 每次触发执行一个扫描点测量, 每点均输出/EOM/INDEX, 但列表扫描比较器结果只在最后的/EOM才输出	
图形扫描	扫描点数	任意点可选, 最多1001点	
	结果显示	同一参数、不同Vg的多条曲线; 同一Vg、不同参数多条曲线	
	显示范围	实时自动、锁定	
	坐标标尺	对数、线性	
	扫描参数	Vg, Vd, Freq	
	触发方式	手动触发一次, 从起点到终点一次扫描完成, 下个触发信号启动新一次扫描	
比较器	结果保存	图形、文件	
	Bin分档	10Bin、PASS、FAIL	
	Bin偏差设置	偏差值、百分偏差值、关	
	Bin模式	容差	
	Bin计数	0-99999	
	档判别	每档最多可设置四个参数极限范围, 四个测试参数结果设档范围内显示对应档号, 超出设定最大档号范围则显示FAIL, 未设置上下限的测试参数自动忽略档判别	
存储调用	PASS/FAIL指示	满足Bin1-10,前面板PASS灯亮, 否则FAIL灯亮	
	内部	约100M非易失存储器测试设定文件	
键盘锁定	外置USB	测试设定文件、截屏图形、记录文件	
		可锁定前面板按键, 其他功能待扩充	
接口	USB HOST	2个USB HOST接口, 可同时接鼠标、键盘, U盘同时只能使用一个	
	USB DEVICE	通用串行总线插座, 小型B类(4个接触位置); 与USB TMC-USB488和USB2.0相符合, 阴接头用于连接外部控制器。	
	LAN	10/100M以太网, 8引脚, 两种速度选择	
	HANDLER	用于Bin分档信号输出	
	RS232C	标准9针, 交叉	
	RS485	标准差分线	
开机预热时间	GPIB	24针D-Sub端口(D-24类), 阴接头与IEEE488.1、2和SCPI兼容	
		60分钟	
输入电压	100-120VAC/198-242VAC可选择, 47-63Hz		
供电电源功率	不小于130VA		
尺寸 (WxHxD) mm	430x177x405		
重量	16kg		

标配附件

电源线一根

TH26063B 测试夹具 (仅TH511和TH512)

TH26063C 测试夹具 (仅TH511和TH512)

TH26063D 连接电缆 (仅TH511和TH512)

TH26063G 测试延长线 (仅TH511和TH512)

TH26071C USB转RC232通讯线缆

TH513-1 测试夹具 (仅TH513)